

水理計測とデータ処理

(ディジタル計測のすすめ)

範 源 亮

1. まえがき

計測は、一般社会においてもよく聞かれる用語であり、時と場合によっては、単にある量をはかるということ以上の内容を含んでいることがある。しかし、プリミティブに意味するものとして、計測は対象である一つの現象において、目的とする量を正確に、その基準量との対比値、すなわち定められている単位表示でもって示すこと理解してよからう。基本的な力学上の単位、例えば長さ、時間、質量等のものはもともと地球上のもの、すなわち子午線長、自転時間、水等から各々定められていたことは周知の事実である。計測された量は、いずれにしても、これら単位の倍数である数値でもって表示しなければならないのであるから、計測方法としては、単位と直接比較して、その倍数を数えるディジタル法を用いるのが自然であることは言うまでもない。確かに、ここで述べようとする水理計測においても、一昔前は、流速測定はプライス流速計を用いて、その回転音を単位時間、数えることより行なったのであるし、長さも、間隔の目盛を数えて距離を求めたように、ディジタル計測法が数多く用いられていた。

その後、電子機器、回路の発達に伴ない、計測量を適切な電気量に変換することが可能となり、計測技術は急速に進歩した。たまたま、このようにして得られた電気量がアナログ量であり、それまで得にくかった連続時系列資料も簡単に求められ、保存されるようになったことから、計測と言えば、電子アナログ法を示すような状態を呈するようになった。同じ電子工学においても、ディジタル関係では、大戦中のレーダー開発の遺産であるフィリップフロップを始め、各種のパルス回路技術が電子計算機の発展をうながしたもの、しばらくは、ソロバンとしての計算機の需要に追われ、これが計測に本格的に利用されるようになつたのは、最近のことである。

現在、ディジタル計測技術が急速に進歩しつつあるその最大の理由には、集積回路の開発と普及があげられよう。

この開発により C P U (中央処理装置) を始めとして、複雑なディジタル回路が、单一プロック化され、従来は計算機メーカー以外ほとんど取扱われなかつたディジタル制御回路が、アナログ回路と同様にいたる所で取扱われるようになり、その結果、数多くの応用機器が計測部門においても見られるようになった。

さらに、これらディジタル機器間を接続する場合、必要になるインターフェース (I / O) も標準化されるに及んで、これを用いることにより、あまり電子回路の知識を持合せていない使用者も、アナログ機器と同様に、各種のディジタル機器を接続出来るため、好むままの計測系を任意に構成し、運用することが可能となつた。

ここでは、主としてこのディジタル計測を中心とした水理計測法について述べようと思う。集積回路から組立てていくディジタル計測については、ハード面にある程度の電子工学の知識を必要とする上、ソフト面においても約 20 年前の初期の計算機を利用した人が経験したように、マイクロプログラム (機械語) を用いる必要があり、ここで述べることは適當と思われないからである。

ディジタル計測系の機器構成は、アナログ系のものとそれほど変つておらず、やはりセンサー・トラン

スデューサー、信号処理機器、記録・表示装置の配列となっている。

ただ、機器において取扱う信号が ON-OFF パルスの配列、すなわちビット配列に意味を持たせたものであり、この点がアナログ計測と異なっている。このビット配列方式には、5ビット (Baudot)、6ビット (EBCD)、7ビット (ASCII)、8ビット (BCD) 等のコードがある上、直列ビットと並列ビットの二方式に分れる。従ってディジタル機器を接続してデーターを送受するには、コード、直・並列形式、転送速度等が一致していなければならぬこのために先に述べた I/O が必要となる。

ディジタル計測系には、一般に計算機等の制御機器が組込まれることが多く、これにより、計測系の各機器の運用、パネル面操作、信号の流れ制御等を行ない、さらに得られた計測量の処理計算並びに結果の図化・印刷まで行なうことが出来る。ディジタル計測系には、このようにアナログ計測系では実行が困難であった自動計測が容易に行なえる利点の他、計測精度が高く、長時間安定した連続計測を行ない得ることも、利点としてあげられよう。

ディジタル計測は歴史も浅く、今後考えるべき問題は多々あろうが、主要な課題はやはり計測量のディジタル変換の方法論であろう。センサー・トランスデューサーからのアナログ信号は、A-D 変換を行なえばよいと考れられるけれども、ディジタル計測系の有する高い精度と処理能力を考えるならば、問題の多い A-D 変換によらず、センサー出力そのものが精度の高いディジタル量であるような計測法を見出すべきであろうと思われる。以下順を追って述べることとする。

2. ディジタル計測法

計測法を述べるに先だって、初めに取扱うべき水理計測量についてふれておくのが順序であろう。しかし、このことについて言及することには、少しためらいを感じる。

今計測の対象とすべき水理現象が与えられたとすれば、この現象について、水理学の相当する学問領域、ならびに支配する法則・量を一応推察することは可能であるから、その量をもって計測すべき量であると考えることが出来る。例えば、理想流体については、 $f(p, v, \rho) = 0$ の関係から、計測されるべきプリミティブな水理量は、圧力 p 、流速 v 、密度 ρ であり、これと別に流れの初期・境界条件のために、時間、長さに関する量が必要となろう。

さらに、二次的な計測量として、温度、渦度、循環の強さ等々が、その関連する法則に基づいてあげられよう。

このように、水理学の中でも、その流れの機構について科学法則が明確にされている領域のものを対象とする場合は、取扱うべきその水理計測量を示すことには、あまり躊躇を覚えない。しかしながら、逆に言えば、その科学法則が明確な事象については、計測の必然性はあまり生じてこない。

C.R.Rao は、「資料はそれが収集された特定の目的のためにのみ吟味されなければならないとか、収集された資料は目前の興味ある問題に解答を与えることが出来れば充分であるといった研究態度は正しいものと言えない。

この態度は確かに科学の進歩のために好ましいものではない。科学史をひもとく時、観察結果に基づく証拠によって得られた新発見のあるものは、資料収集の段階において、研究者が全く予期しなかったものであることを思い起こすべきであろう」と述べており、筆者はこれと全く同意見である。このようなことを考えると、ここで水理計測量について、これ以上ふれることは適切と思われず、話を先に進めることとする。

2-1. 計測機器

現在入手が容易なディジタル計測機器にどのようなものがあるか調べてみた。その結果を表-1に示す。これらのディジタル機器の調査は、実際の使用、手近にあるカタログ、学会誌・専門誌等の広告にもとづいたもの故、すべてを網羅しているわけではなく、見落し、あるいはもっと機能の高いもの等あるやも知れないが、水理計測に多少なりとも関係があると思われるものは取上げたつもりである。ただ取上げたディジタル機器は、少なくとも、入出力のいずれかがディジタル信号であるものであり、この両者共アナログ量であるものは、たとえ水理計測上重要であっても、この表には入れていない。

この表から、ただちにわかるることは、計測機器の入力が計数量の場合、その計測機器の精度、確度は共に高く、またその測定範囲も広いことである。計測機器の入力が計数出来る量であることは、もともと計測量が波数のように数える量であるか、あるいは、時間、長さといったように、高精密なディジタル“物指し”が完成されており、計測は単にこの“物指し”的数をカウントするだけの方式である。

この表にあげた機器の中の多くのものは、入力が先にも述べたようにアナログ量であり、機器内でA-D変換を行ないデジタル化している。これらのものは、精度・確度共上記のものに比べれば劣っている。現在の水理計測法では、センサー・トランスデューサーの出力がアナログ量でしか得られないものが数多く見られ、これを直ちに計数化出来ることには困難である。従ってA-D変換は、計測量のデジタル化のため、今後共活用されるであろうし、また現在最もよく使用されているディジタル機器の一つである。これは直接計測の精度と確度に大きく影響するため、ここで取上げて述べることとする。

2-2. A-D 変換

A-D変換器は、アナログ量をデジタル量に変換するためのものであり、その用途は広く、アナログ計測の結果を用いて、処理計算を行なう場合にしばしば利用される。

A-D変換は、その変換の方法別に分類すると表-2に示すようになる。これらの方にはそれぞれ特色があり、例えば、変換速度は低速度でもよいが精度の高いことを要求する場合には、積分方式が、また精度はそれほどでもないが、高速変換を要求する場合には、比較方式が適している。一般にデジタルメモリー等として製品化されているものには、逐次比較方式が多く、テレビ画像のように高速変換を必要とするものでは、並列比較方式が、さらにデジタルマルチメーターのように高精度の変換が要求されるものには積分方式が用いられている。これらの方の主なものを取り上げその変換方法等について述べることにする。

(1) デュアルスロープ型

表-2を参照して、積分方式中の電圧一時間変換型（V-T変換）の一つであるデュアルスロープの動作は図-1に示すように、スイッチ回路 S_1 をONとして変換する入力電圧 V_i を一定時間 T_i の間だけ積分回路に入力し、積分させた後 S_1 をOFF、 S_2 をONにして、入力電圧 V_i と逆極性の基準電圧 $-V_r$ を積分回路に入れ、先きの V_i による積分と加え、これが零となるまでの時間 T_r を求める。この T_r は、 $T_r = (V_i/V_r) \cdot T_i$ で与えられ、これを時間カウンタ回路で計数することにより、入力電圧 V_i のデジタル化を行なう。

(2) 電荷平衡型

電圧一周波数変換（V-F変換）の一つである電荷平衡型は図-2に示すように、変換しようとする入力アナログ電圧 V_i は常時入力しておき、これに逆極性の基準電圧 $-V_r$ をスイッチ回路 S により一定時間幅でON-OFFを繰返し操作させたものを加え、この繰返し回数を調整して、積分回路の出力がちょうど打ち消されるようにする。このときの上記の繰返し回数は入力電圧 V_i と比例関係にあるため、これを計数

表-1 デジタル機器 (1)

計測量	デジタル計測機器名	機能	精度	測定範囲	動特性	使用例
座標	グラフペンシステム ディジタイザータブレット	画像・図等よりペン、カーソルを用いて座標値を読み取る	0.1 mm	各種	連続読込可	地図のデジタル化
	インテリジェント CRT カラー画像ディジタイザー	画像の記憶	各種	1 画像	画像解析	
角度	回転スケール	磁気スケールの読み込み	$0.1'' \frac{\pi}{180} \times 60 \times 60 rad$	$360^\circ (2\pi rad)$		
長さ	マグネットスケール デジタルマイクロメーター デジタルダイヤルゲージ		0.01 mm 1 μm	0 ~ 30 m (各種) 0 ~ 30 mm		ポイントゲージ
	超音波水位計	音の伝播時間応用	±0.5% (FS)	1.5 ~ 10 m	0 ~ 10 Hz	波高測定
	リニヤーポテンショメーター エディセンサー	抵抗値の読み取り 非接触、渦電流変化利用	0.05% ±0.01% (FS)	10 ~ 1000 mm 0 ~ 20 mm		センサー位置読取 水中使用可
	ポジションセンサー	LED の光学追跡	±0.2%	各種	0 ~ 400 kHz	振動計測
レーザー測長システム	ホログラフィシステム マイケルソントワイマン干渉計	光干渉縞の読み取り	0.2 μm	各種	微小変位計測	
モレカメラ	モアレトボグラフィの応用	1 mm	30 × 25 cm		等高線	
周辺面積	パーシングナライザー エリニアック マイクロデンシトメーター デジタル面積計	光学方法、粒径、面積、周辺長、濃淡計測 光学的に木の葉等の実物面積計測	各種	2 %	各種	写真解析 空隙率

表-1 ディジタル機器 (2)

計測量	ディジタル計測機器名	機能他	精度	測定範囲	動特性	使用例
時 間	デジタルロックカレンダー	年月日時分秒の表示	10^{-6} (水晶発振子)			
周波数	プログラムタイマー					
	ユニバーサルカウンター	周波数・周期・時間間隔・周波数比	± 1 カウント	各種	サンプル 毎秒 285 回	
	周波数カウンター	・計数計測				
質 量	デジタル天秤					
圧 力	デジタル比重計	0.001 g		各種		
	デジタルウェイングインデケーター					
	デジタル歪計					
	デジタルノーメーター	抵抗線・半導体歪ゲージの応用	0.2% (FS)	各種		
	ピエゾ圧力計	ピエゾ効果応用				
水 晶	水晶圧力計	発振周波数が圧力変化するのを応用	$\pm 0.01\%$ (FS)	各種		
温 度	デジタル温度計	熱電対利用	0.1°C	各種	10 Hz	水温計測
	赤外線放射温度計	InSb 利用 非接触	0.5°C	-10 ~ 300°C	5 Hz	地表面温度測定
	水晶温度計		0.04°C	-80 ~ 250°C		検定用
流 速	デジタル回転流速計		1 cm/s	2.5 ~ 100 cm/s		プロペラ流速計等
	デジタル超音波流速計	ドップラー効果の応用	2 mm/s	0 ~ ± 2.5 m/s		
	レーザードップラー流速計		0.25 %	高	高	
流 量	フルイディクス流量計	流体素子振動を利用				
	コリオリジャイロ流量計	U字管のコリオリ力を利用	$\pm 0.4\%$	1800 kg/min		
	ターゲット流量計	ターゲットの歪を利用	$\pm 0.5\%$ (FS)	350 kg/cm ²		

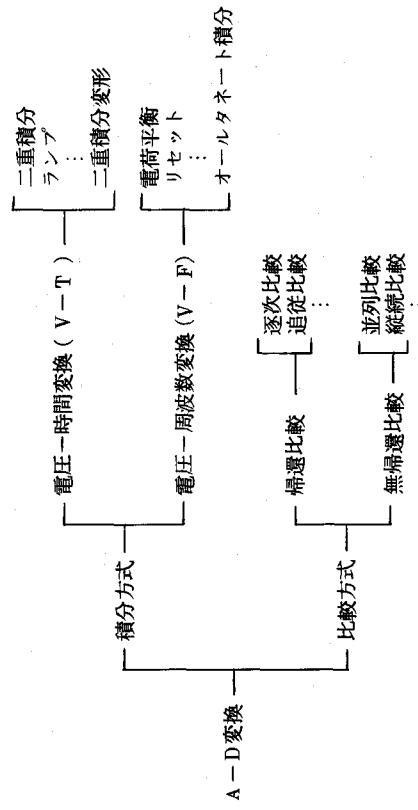
表-1 ディジタル機器(3)

計測量	ディジタル計測機器名	機能	精度	測定範囲	動特性	使用例
音	AE カウンター ディジタル騒音計	圧電素子チャージアンプ利用	5 μ V	10 KHz ~ 2 MHz		キャビテーション計測
電気	ディジタルマルチメーター	電圧・電流・抵抗計測	0.005 %	各種	サンプル数 300回/秒	高精能テスター
放射能	シンチレーションカウンター ニュートレムカウンター	散乱放射線の測定	1.0 %	各種		土の密度測定
光	ディジタル光度計 ディジタル日射熱量計	センサー取替により光量子計、照度計、 放射熱量計 積算可	± 1 % (FS) 1 W/m ²	各種		濃度計測 水中計測可
	フォトンカウンター	極微弱光の測定、光電子増倍管を使用	15 μ V	50 ~ 500 μ V	100 MHz	散乱光測定
保存	各種計算機					
処理	ディジタルメモリー トランジエントメモリー シグナルアナライザー ディジタルスペクトラムアナライザー	A-D 変換	各種	各種	各種	アナログ信号の デジタル化
	トランシングアナライザー	A-D 変換 + 平均、相関、FFT 等の 機能付	各種	各種	各種	
表示	上記にトラッキングジェネレーター付 インテリジェントグラフィックディスプレー カラーディスプレー インテリジェントプリンター インテリジェント X-Y プロッター ビデオプリンター	各種	各種	各種	各種	メカニカルインピード ンス計測 計算機端末

表-1 ディジタル機器 (4)

計測量	ディジタル計測機器名	機能	精度	測定範囲	動特性	使用例
出力	ファンクションアナライザ ファンクションジェネレーター AM-FMシンセサイザー	デジタル制御による安定高低周波発振器	各種	各種	各種	任意波形出力不規則波発生
	プログラマブル電圧電流発生器	デジタル制御によるDC, 矩形低周波発生	±0.001%	各種	1000 Hz	各種安定電源
その他	多点ディジタルデータユニット バーコードリーダー	スキャナ 光学文字読み取り				多点測定に使用
	オプティカルスキャナー					入力に使用
	光ファイバ-HP-IBリンク	高速データ転送用				
	ファイバーオプティックデータリンク	高速データ転送用	100 m	20 Kペイト/秒	機器接続	
	ロジックアナライザ パーターンジェネレーター	デジタル信号のチェック				I/O等のタイミング判定

表-2 A-D変換法



カウンタ回路で求めることにより、入力電圧 V_i をデジタル変換させる。この方式は入力と計数が同時に進行なわれるため、V-T変換よりも変換速度が速い。

(3) 逐次比較型

帰還比較方式の逐次比較型のものは、図-3に示すように、入力と同時に逐次比較レジスターの最上位ビットから1ビットずつ設定し、その都度D-A変換して入力電圧と比較しながら、その“H”, “L”を決定して下位ビットに移行し、最下位ビットまで設定する。従ってこの方式の精度は、レジスターのビット数によって定まり、8ビットでは、フルスケールを $1/256$ に、10ビットでは $1/1024$ に分割することとなる。この方式は変換速度、精度、価格共手頃なため、よく用いられている。

(4) 並列型

無帰還比較方式の並列型は図-4に示すように基準電圧を 2^n 個に分割したもと入力電圧 V_i を同時に($2^n - 1$)個の比較器で比較を行ない、これにより“H”, “L”を決定し、デコーダにより n ビットのデジタル信号として出力するものである。このように入力を並列処理出来るため変換速度は各A-D変換中最高である。しかし分解能を高めるためには、数多くの比較器を必要とするため、他の方式に比べて不利であり、低ビットのもの例えばテレビ画像濃淡のデジタル化等に用いられる。

以上述べたA-D変換の機構からもわかるように、デジタル機器では、カウンタ回路が種々関係している。

直接カウンタ回路を用いた計測機器には、表-1に示したユニバーサルカウンターがあり、時間、周波数、周期、計数等の計測に用いられる。次にその機能について述べる。

2-3. ユニバーサルカウンター

波数、周波数を計測する場合のカウンタ機能は、図-5を参照して、(1)アナログ入力波電圧を(2)波形整形回路で整形して矩形波とし、(3)これを微分回路によりパルスにしたものと(4)別の基準発振器(水晶発

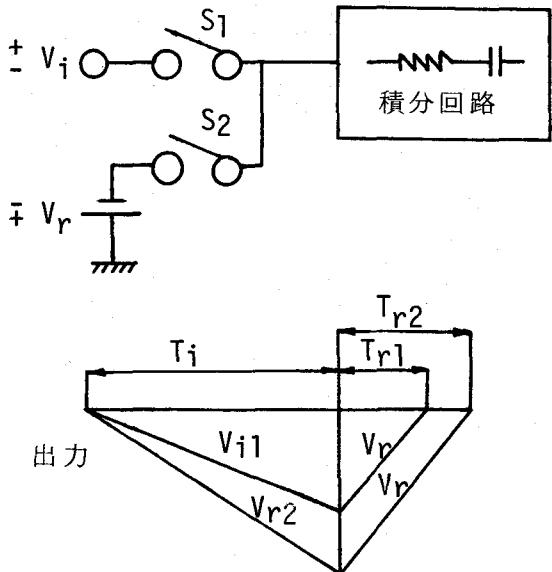


図-1 デュアルスロープ型

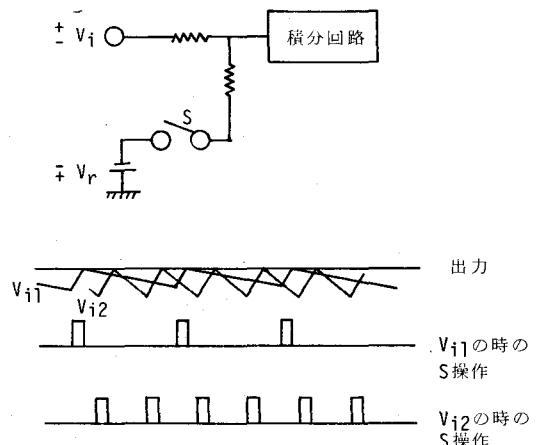


図-2 電荷平衡型

振)からの高周波出力を分周して得られる単位時間間隔のパルスによって(6)制御されたゲート信号で(7)サンプリングしたパルスの数を計数して周波数を求める。またこの逆数から周期を求めている。カウンタ回路では、基準水晶発振の確度がそのままカウンターの確度となり、この値は極めて高い。

現象と現象の間の時間間隔の測定は、図-6を参照して入力信号から(1)計測開始と(2)終了を示すトリガーパルスを得て、この間(3)ゲート信号を開にし、基準発振器による(4)基準パルスを(5)計数して時間を求める。

計数を行なう場合は、基準パルスのかわりに、計数量である入力パルス数をゲート信号が開の間計数する。この時ゲート信号の開閉は手動によっても行なうことが出来る。

最近はIC化されたV-F変換器が容易に入手出来るからこれと周波数カウンターを用いれば簡単にA-D変換を行なうことが出来る。その回路を図-7に示す。

サンプリング速度は周波数カウンターのもので定まる。

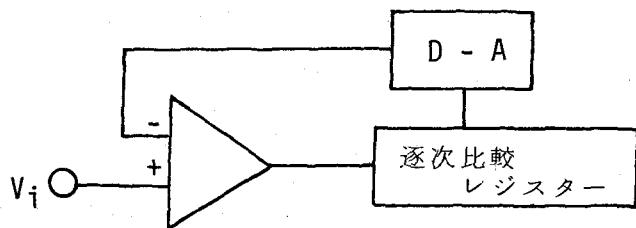


図-3 逐次比較型

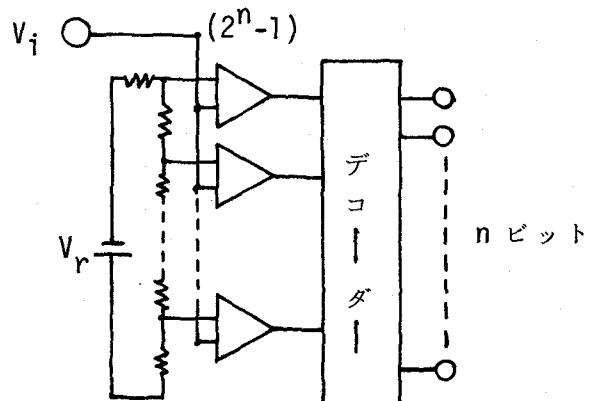


図-4 並列型

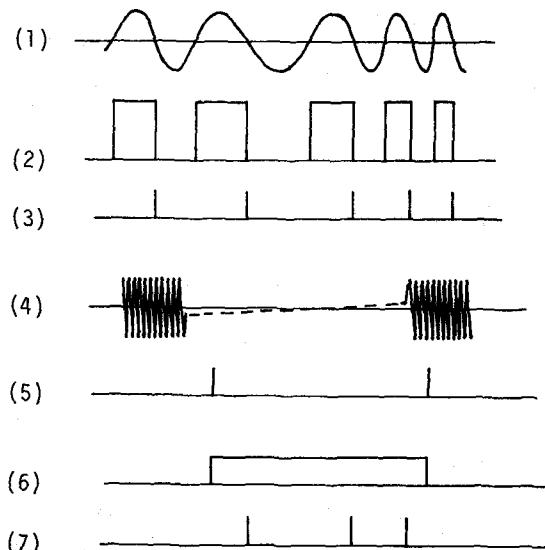


図-5 カウンターによる周期周波数計測

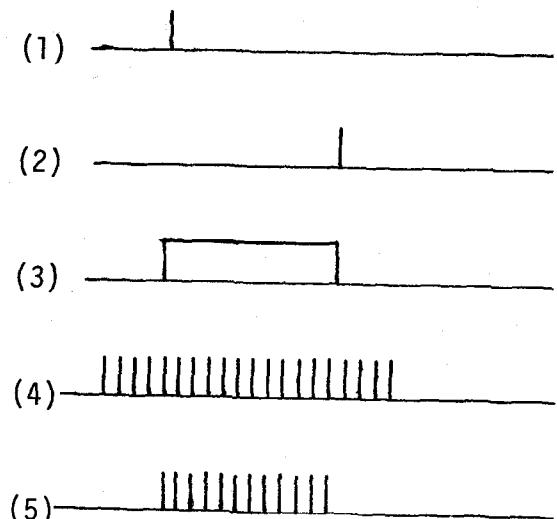


図-6 カウンターによる時間間隔測定

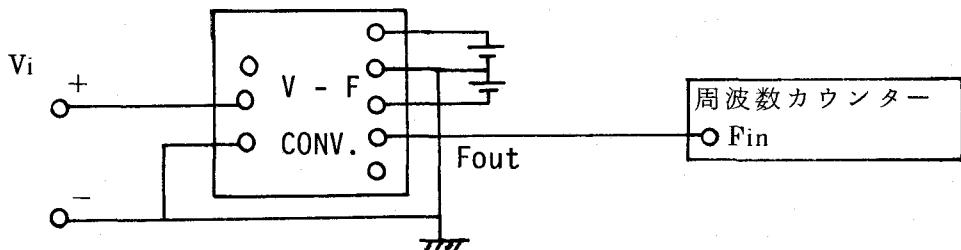


図-7 V-F変換を用いたA-D変換

2-4. 計測センサー・トランスデューサー

既に述べたように、計測量がセンサー・トランスデューサーにより、周波数、時間、あるいはパルス数等のような計数可能なものに変換されている場合には、上記のカウンターを用いて直ちに計測量を求めることが出来る。

水理計測においては、流速・流量の測定の場合に、このようなセンサー・トランスデューサーがよく用いられている。代表的なもの二、三を次に示す。

(1) 回転流速計

この型のものは、従来からよく用いられており、プロペラ、羽根車等を流れの中において、その回転数から流速あるいは流量を求めている。使用目的によって、その構造は種々工夫されており、水道の家庭用メーターから、気象・海洋観測用のものまで広く利用されている。回転数のカウント法も機械的なものから、光・電磁スイッチ回路の応用まで種々にさまざまである。

(2) 湧流速計

流れに円柱等の物体が置かれた場合、その後流に生じるカルマン渦の発生周波数を測定することにより、流速・流量を求める。レイノルズ数 Ud/ν が $10^3 \sim 4$ 付近では、ストローハル数 nd/U が一定値 (≈ 0.21) となることを利用している。ここで、記号 U, d, ν, n は各々流速、円柱径、動粘性係数、カルマン渦の振動数を表す。管路の湧流速計では、管径 D とこれに設置する円柱径 d の比 d/D は、 $0.15 \sim 0.25$ の範囲が多いとされている。

(3) トレーサー法

トレーサーを流れに投入し、流下距離と時間から流速を求める方法には、簡単なものは塩水法から、広い意味では後で述べるドップラー法まで数多く見られ、いずれの方法も、トレーサーとその移動量計測に工夫をこらしている。開水路流れのように自由表面を有するものでは、トレーサーには光反射の大きな金属粉末を使用し、写真計測から流速を求めている。この手法は将来画像処理（テレビ画像）の発達と共にさらに発展することであろう。

表面流速ではなく、流れの中の流速を求めるものとして、フォトルミネッセンス法がある。ルミネッセンス現象は、物質にエネルギーを供給することにより、常温でそれが発光する現象を言う。これには、エネルギーの供給中だけ発光する螢光現象と、供給後もそのエネルギーをたくわえ、発光を持続する燐光現象とがある。この区別はそれほど厳密でなく、例えば、ルミネッセンス物質には種々のものがあるが、無機質の結晶体は総称して螢光物質と呼ばれており、エネルギー供給後の発光も残光とよばれている。トレーサーには、この残光性の良いものが適している。エネルギー供給法も数多いが、光を用いる場合が多く、

この時ストークスの法則によって螢光物質の発光波長は、エネルギー供給した光の波長より長くなる。従って、エネルギー供給光には紫外線領域のものが用いられる(He-Cd レーザー等)。螢光物質の例を表-3 に示す。流れのトレーサーに用いる場合、供給エネルギーの散乱と関連して、最適なトレーサー濃度が存在する。残光は微弱故、光電子増倍

管を用いて検出される。

(4) ドップラーフローメーター

これまで述べた流速計測センサーは、主として平均流速を計測するものであり、応答周波数特性はそれほど高くない。乱流計測にはよく熱線流速計が用いられているけれども、流れに含まれる微小なごみが熱線に付着することにより確度が低い欠点があり、長時間計測には適さない。

最近は、波動のドップラーフェルトを応用した流速計測法がよく用いられるようになった。この方法では、流れにトレーサーとして微小粒子を投入し、それからの散乱波動の周波数変化より流速を求めることが多い。波動には、レーザー光がよく用いられる。ドップラーシフトされた周波数変化 Δf は、光の波長を λ 、その入射方向の単位ベクトルを K_i 、流れの中の速度 V の粒子によって散乱させられた光の受信方向の単位ベクトルを K_o とすると、 $\Delta f = \frac{V}{\lambda} \cdot (K_i - K_o)$ で与えられる。このドップラーフ周波数 Δf は、光電子増倍管等の使用により光-電変換を行なって計測する。雑音を含むその信号処理には、単なるカウンターではなく、多少高級なトラッキングアナライザ等の機器を必要とする。

(5) モアレ縞

計測量が長さである場合には表-1 に示すように多くのすぐれた機器がある。動計測の場合には、実時間ホログラフィ法により、精密な三次元計測を行なうことも可能である。

モアレ縞による計測は、手法そのものはそれほど複雑でないけれども、精密な光学格子を作成することはなかなか困難である。図-8 に示すように細線をこまかいピッチ d (格子常数) で平行に並べた光学格子を二枚、図-8 のよう

に角 θ だけ傾けて密着させると、これら格子の横方向に見られる太い平行縞を生じる。これがモアレ縞である。この縞の間隔 D は θ が小さいと、 $D = d/\theta$ で表わされる。今上下どちらかの格子を横方向に d だけ移動させると縞は D だけ縦方向に移動する。これより明らかのように、モアレ縞は一

表-3 萤光物質

組成	発光色	平均粒径	比重	残光
ZnS:Ag	青	10.7 μm	4.09	短
Zn ₂ SO ₄ :Mn	緑	7 μm	3.9	短
4Mg(O ₂ F ₂)GeO ₂ :Mn	赤	4 μm	3.8	短
ZnS:Cu	緑	14 μm	4.09	長
YVO ₅	赤	4 μm	4.1	短
ZnS:CuCl	オレンジ	14 μm	4.29	長
ZnS ₁ CdS:Ag	黄	14 μm	4.18	長

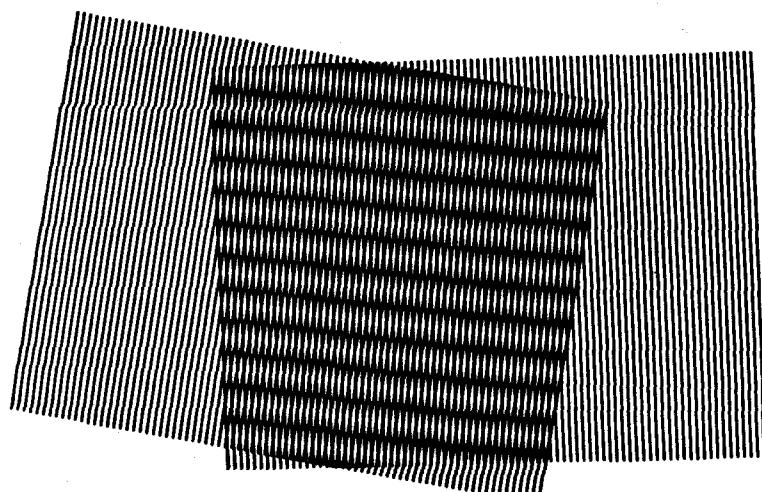


図-8 モアレ縞

種の長さの拡大装置であり、格子の移動方向に従って、縞の移動方向も変化するため、方向も判別出来る。また格子が部分的に不完全であっても縞にはそれほど影響を受けず誤差平均作用を持っている。格子常数が小さくなると光の回折現象が現われるが、この時0次と1次の回折光だけ利用するようにすれば縞の濃淡差は最大となる。縞の読み取には、フォトダイオード等により光一電変換を行なえば、その処理にはカウンターを利用することが出来る。

格子の移動が縦横どちらに移動するか不明のものでは図-9に示すような点光学格子を二枚用いれば、その配列によって、図-

9に示すような模様が表われ、格子の横移動ではこれが縦に、縦移動ではこれが横方向に移動することから任意方向の移動量を求めることが出来る。

(6) 密度・温度・圧力

センサー

流体の密度変化は光の干渉を利用して計測される。光の干渉は光路差によって生じる。流体に密度差があると、光の屈折率が変化することにより

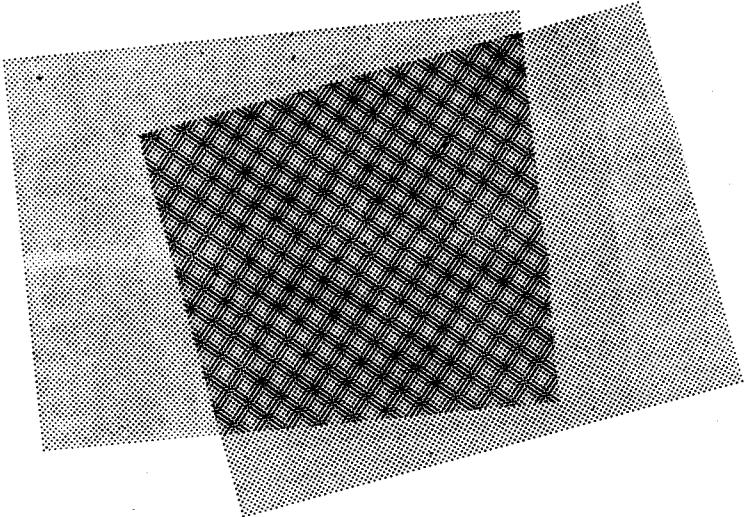


図-9 変形モアレ縞

光路差を生じる。光路を分岐し、一方を密度を計測する流体場を通過させ、後、もう一方の密度変化のない流体場を通過させたものと合成する方法を用いれば、その密度変化は干渉縞として得る。このような干渉計には、マッハツェンダー、シュリーレン、二重ホログラフィ等がよく用いられる。干渉縞から密度差を求めるには、グラドストン・ダルにより、光の場と分子配列のディストーションの関係から導かれた屈折率nと密度ρとの関係式 $n - 1 = K\rho$ ($K \approx 0.23$ (空気)) を用い、干渉縞の変化 $\Delta S/S$ が屈折率あるいは密度の変化と次の関係があることを利用して密度を求める。

$$\Delta S/S = \left(\frac{L}{\lambda} \right) (n_1 - n_0) = \left(\frac{LK}{\lambda} \right) (\rho_1 - \rho_0)$$

ここで、Lは試料を通る光路長、λは用いた光の波長である。

基礎量の計測において、温度計測のセンサー・トランスデューサーは、一番開発が遅れている部門といわれている。確かにアナログ系のものでは、熱電対(白金-ロジウム、銅-コニスタンタン等)、白金抵抗体、サーミスター等があるが精度・確度共充分でない。わずかに、デジタル系では、水晶発振子の周波数変化を利用したものが満足されているに過ぎない。

圧力計測についても同様に、アナログ系のセンサーには抵抗線歪ゲージを始めとして、半導体ゲージ等があるけれども、デジタル系では、やはり水晶発振子の周波数変化を利用したもののが見られる程度で、これを試用、試作したこともなく、ここで述べることは適当と考えない。

2-5. インターフェース

インターフェース(I/O)はデジタル機器の入出力機構であり、デジタル機器をお互いに接続する場合に必要となる。例として、サーミスターを用いて温度を計測しようとするとサーミスター、ブリッジ・増巾器、A-D変換器、出力機器(プリンター)の計測系が考えられる。

サーミスターから A-D変換器まではアナログ信号の伝送故、その接続は問題ないが A-D変換器の出力とプリンターとの間はデジタル信号が伝送されるため、その接続は簡単でなく、ここに I/O が用いられる。

この I/O は A-D変換から出力されるデジタル信号の仕様とプリンターで受付けるデジタル信号の仕様の両者にあわせたものでなければならぬ。従ってプリンターのかわりに直接データーの処理計算を行なおうとして計算機を持って来ても、I/O の仕様が一致せず接続することは出来ない。この様にこれまでのデジタル機器では、I/O が特定の機器の間の接続のために個別に用意されており、そのまま任意の機器間の接続を行なうことは出来なかつた。従って、これまでにはたとえデジタル計測法について数多くのアイディアを持っていても、I/O をすべて個別に設計しなければならず実行することが極めて困難であった。

昭和 50 年に一つの標準化された I/O が規格化され、最近では、この規格化された I/O を付したデジタル計測機器が数多く製品化されるようになった。この標準 I/O は一般に GP-IB, IEEE-488 等と呼ばれるものである。

以前からも RS 232 C と呼ばれる準標準的な I/O があった。この二つの I/O を比較して GP-IB の特色を述べると、GP-IB が非同期、並列デジタル信号(7 ~ 8 ビット)の伝送であるのに対して、RS 232 C は同期直列デジタル信号の伝送であり、前者が 15 台までの機器を接続出来るのに対して、後者は 2 台の間しか接続出来ない。前者はほぼ完全に規格化されているためソフト知識だけで接続出来るのに反して、後者はコネクターの形式すら定まっておらず、接続には多少ハードの知識を必要とする。

デジタル計測系には通常計算機が組込まれる。これは、計測量の処理計算等のためだけではなく、計測系に組込まれた多数のデジタル機器の運用を制御し、自動計測を行なうために必要となる。この計算機は機能上最近よく見られるデスクトップ型の小型計算機で充分である。

その理由は、最近の計算機には、この計算機の負担を軽くするために、処理能力を付加したいわゆるインテリジェント機能を持ったものが多いこと、またこれら小型計算機は、モデルを介してセンター等の大型計算機と接続出来るため、小型以上の計算機をこの用途に用いてあまり意味はないからである。

ここでは、GP-IB を用いたデジタル機器の接続について述べる。この I/O の制御のために小型計算機が計測系に組込まれているものとする。この I/O に接続されるデジタル機器は、機能上から、コントローラー、トーカー、リストナーのいずれかに分類される。コントローラーとは、計測系の各機器の運用、データーの流れ等を制御する機能をもつ機器であり、先に述べた小型計算機がこれに相当する。トーカーはデーターを送り出す機器であり、リストナーはデーターを受取る機器である。一つの機器で二つ以上の機能を持つものもある。すなわち小型計算機はそれ自身データーを送り出すことも、受取ることも出来る故、ある場合はコントローラー、ある場合はトーカー、ある場合はリストナーとなる。

機器を接続するラインのコネクターは 24 ピンのものであり、型が定まっており、いくつも重ねて接続出来るよう雌雄一体の構造となっている。このコネクターを用いて、トーカーあるいはリストナーである各計測機器とコントローラーである小型計算機とを接続しても、単にそれだけではデーターの転送は行なわれ

ない。コントローラーである小型計算機から、このI/O、ならびに接続されている各計測機器をオペレートしてやらなければならないからである。この指令は小型計算機からのプログラムによって行なう。

具体例について、その指令プログラムを示し、このI/Oの接続法を説明する。今波動現象の周期計測を行なうこととし、ユニバーサルカウンターと小型計算機をこのI/Oにより接続する。カウンターには電圧変動に変換された波動が入力されているものとする。具体的な指令プログラムは次の通りである。ただしこのプログラムの言語・文法等は使用する機器により異なるが、その基本的な構成は同じである。ここではプログラム言語にAPLを用いている。

```
[1] )LINK 1
      .
[2] )LOAD 3
      — • — • —
      ▽ GPIB [□] ▽
[1] 1 □SVO 3 3 Ⓜ'PIOPICTII'
[2] PIO ← 'OUT 76001'
[3] PIC ← 'OUT 71001'
[4] PII ← 'IN 77001'
[5] PIO
[6] PIC
[7] PII
[8] PIC ← 'I/50, O/50, /7, T/A, L/I, A/E, S/C'
[9] PIO ← '▽G ▽A ? A6 ▽C ▽B'
[10] PIO ← 'SOF3MIT3S3S4AS6S8IOL+00BS6S8IOL+00'
[11] PIO ← '▽A ? A6 ▽BE'
[12] PIO ← '▽A ? 1V ▽B'
[13] PII
[14] → 11 ▽
```

このプログラムは二つの部分から成立っている。最初のものは、フロッピーディスクからマイクロプログラムを計算機メモリーに呼出すものであり、直接I/Oの指令と関係ない。後の15行が指令プログラムである。最初の[1]～[7]がマイクロプログラムを計算機作業域に呼出すものである。[8]は計算機側のI/Oの機能設定である。これでバッファーメモリー、使用するコード、アドレス等の設定を行なう。[9]は[10]の指令伝達のためにI/Oを接続する指令であり、[10]はユニバーサルカウンターのパネル操作である。すなわちカウンターに付属している各スイッチ、ツマミ類を手動で操作するかわりに、プログラム指令によって行なう。[11]は測定開始を指令する。[12]は[13]のデーター受入れのためのI/Oの接続指令であり、[13]はカウンターの計測したデーターを計算機に送らせる指令である。送られて来たデーターは計算機のディスプレー上に表示される。引続いて計測を行ない、データー転送を望む場合は、[14]の指令で[11]のプログラムに帰還させ繰返す。計測条件を順次変更して行くような自動計測では、[14]の指令を変えて、[10]にとばせる。[10]の内容を順次変更するのは、従

來のソフト技術をそのまま応用すればよい。この指令プログラムのままでは、エンドレス故、無制限にデーターが計算機に流れ込むが、これを必要個数にとどめる手法も従来のソフトをそのまま応用すればよい。計算機に接続される計測器が一台の時は、このような指令プログラムでよいが、複数の台数の場合は一台ごとにデーターを転送させなければならない。その指令プログラムを次に示す。

▽ GP - IB [□] ▽

[1] 1 □ SVO 4 3 σ' PIOPICPPIIPIT'

[4.5] PIT ← ' IN 74001 '

[7.5] PIT

[11] IO : PIO ← ' ▽A ? A6 ▽BE '

[11.1] → (PIT [□ IO+5] = ' E ') / POLL

[11.2] POLL : PIO ← ' ▽A ? 1 ▽B ▽JVV ▽K '

[11.3] → (A/PIT [□ IO+10 11] = ' VV '), (.....), .../DV,

[13.1] DV : DVA ← PII

[13.2]

[14] → IO ▽

この指令プログラムが前記のものと異なる主な所は [11.1] ~ [11.3] であり、[11.1] はサービス要求、すなわち計測を完了しデーター転送待ちをしている機器の有無を調べる。もしあれば、[11.2] で機器を順次呼出し、[11.3] でそれらの機器を求め、以下前同様にそれらと接続しデーターを転送させる。この方式はシリアルポール方式と呼ばれるものである。

以上二つの標準的な接続によって、データー転送を実際にさせてみると、転送速度は遅く、毎秒 4 ~ 2 個のデーターしか転送出来ない。その原因是、データー、一つ一つについて、その送受を確認しながら転送する方式のため、時間がかかるからである。このため、カウンターのサンプリングにより連続計測しているデーターを一群として取扱い、一括転送する方法を試みた。その指令プログラムは次の通りである。

▽ GPIB [□]

[1]

[8] PIC ← ' I/3000, A/D,

[10] PIO ← 'T3S2S4.....'

[13] PII ▽

この指令がこれまでのものと異なるのは、[8]でインプットバッファーメモリーを増大させ、A/Dによりデーターを群として取扱う。また[10]ではS2によりカウンターのサンプルホールドを解除される。このようにすると、データーはバッファーメモリーが一杯になるまで連続転送される。

その転送速度は毎秒93個のデーター転送であり、これはカウンターのサンプリング速度で決定される。

以上のことから明らかなように、このI/Oを活用するには、その指令プログラムが自由に作成出来るソフト命令語が豊富でなければならない。種々の自動計測には、計測系の機器構成だけでなく、このI/Oの指令プログラムの開発が必要である。

3. 計測誤差とデーター処理

ディジタル計測にともなう誤差は、計測系の入出力過程においてのみ生じる。すなわち、センサー・トランスデューサーがおかれた場の計測環境の変化に起因するものは、アナログ計測と全く同様であり、これらセンサー等からのアナログ信号をA-D変換によりディジタル量に変換する場合、また計測系からの出力をD-A変換してアナログ出力する場合に生じるのであって、一度信号がディジタル化されてしまえば計算機と同様に系内で誤差は生じない。

入力信号が雑音をともなうパルス信号を計数する場合は、フィルター等によりS/N比を改善した後、閾値を定めてカウントさせるが、この閾値は高すぎても低すぎてもミスカウントする恐れがあり、その値の決定は重要である。

カウンターの原理上から生じる誤差に1カウント誤差があり、これは入力パルス群とサンプリングゲートがオープンするタイミングによって、必然的に最小桁に1カウントの誤差を生じるものでさることは出来ない。

3-1. 計測誤差とその除去

ここでは、計測系入力部のセンサー・トランスデューサーの計測環境において生じる誤差とA-D変換に伴なって生じる誤差について述べることとする。

(1) センサー等の誤差

計測系のセンサー等は、計測量を ψ_1 とする時、これを計測系で処理可能な量 ϕ に科学法則を応用して、 $\phi = f_1(\psi_1)$ と変換する機能を持っている。

計測時にその場では、 ψ_1 だけが存在しているのではなく、他の量 ψ_2, ψ_3, \dots も存在し、これらの量の間に科学法則、 $f_2(\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots) = 0$ が成立しているため、実際の計測では、 $\phi = g(\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots)$ の関係が成立することになる。

例えば、レーザードップラーフローティクス流速計を考えると、センサー・トランスデューサーの出力として得られるドップラーフローティクス流速 A_f は、 $A_f = g(V, \lambda, n, \theta, \rho, \dots)$ のように単に流速 V だけでなく、レーザー光の波長 λ 、流れの場の光屈折率 n 、光の入射・散乱角 θ 、密度 ρ 等の変化によってもその値は変化する。この流速計では、流速 V 以外の諸量は、もとより一定に保つ計測環境において、実施されるものであるけれども、それはかならずしも完全と言うわけにはいかない。これらの変動に起因するものが雑音となり、誤差 $\Delta(A_f)$ としてセンサー等より出力される。

$$\Delta(\Delta f) = \frac{\partial g}{\partial \lambda} \Delta \lambda + \frac{\partial g}{\partial n} \Delta n + \frac{\partial g}{\partial \theta} \Delta \theta + \frac{\partial g}{\partial \rho} \Delta \rho + \dots$$

この誤差は観測値 ϕ が時系列資料として得られる時には、次のような相関計算により、推定することが出来る。

今、時間 t における真値を $\phi(t)$ 、観測値を $\bar{\phi}(t)$ とし、誤差を $\epsilon(t)$ とすると、

$$\bar{\phi}(t) = \phi(t) + \epsilon(t)$$

であり、時間 ($t + \delta t$) では、

$$\bar{\phi}(t + \delta t) = \phi(t + \delta t) + \epsilon(t + \delta t)$$

である。この時、

$$E(\delta t) = \overline{[\bar{\phi}(t + \delta t) - \bar{\phi}(t)]^2}$$

を求めるとき、真値と誤差の間には、相関がなく、また t 時と $(t + \delta t)$ 時の誤差の間にも $\delta t \neq 0$ ならば相関はないと考えられる故、

$$E(\delta t) = \overline{[\phi(t + \delta t) - \phi(t)]^2} + 2\epsilon^2$$

$$\text{となる。ただし } \overline{[\epsilon(t + \delta t)]^2} = \overline{[\epsilon(t)]^2} \equiv \epsilon^2$$

$$\lim_{\delta t \rightarrow 0} E(\delta t) = \overline{2\epsilon^2}$$

から誤差 $\sqrt{\epsilon^2}$ を推定することが出来る。この誤差は計測にともなって生じるランダムなものについての推定値であり、計測当初の設定値にオフセットされてしまった誤差は見出しが出来ない。この手法は、各 δt ごとの $E(\delta t)$ を求め、 $E(0)$ を外挿することにより誤差を求めるのであるが、その外挿方法により少し値が異なる。

計測量の最確値は、各平均法、相関法、フィルター法等を用いることにより求められる。これらの方法は良く知られており、参考文献も多いこと故ここでは述べない。

これらの手法、特に平均法あるいは相関法は静的なデータ処理によく用いられるけれども、データが周期性（周期はかならずしも一定でなくてもよい）のものであり、その周期を別途確実に求めることができれば、それに同期させてサンプリングしたデータについて、これらの手法を用いれば、動的データの場合でも雑音を除去させることが出来る。すなわち計測系では、計測場を含めた帰還回路を形成することができれば、これらの手法により高い信号-雑音比の測定を実施することが可能である。

これらの手法はかならずしもデータが得られた後、別途計算機を用いて数値計算により行なうものとはかぎっておらず、計算機器内にマイクロプロセッサーとメモリー等を用いて、これらの手法を回路として組立ててしまう、いわゆる金物化したもので、入力してくるデータを順次処理出力することも行なわれている。カルマンフィルターについてその例を述べる。

流量 q により、回転しているプロペラ流量計は、プロペラの慣性モーメントを J 、角速度を ω 、回転摩擦係数を μ 、トルク定数を K とすると、

$$J \frac{d\omega}{dt} + \mu\omega = Kq$$

で与えられるであろう。これを差分式に書きなおし、 ω を x 、 q を u とおけば、

$$x_{k+1} = A_k x_k + B_k u_k$$

となり、これはカルマンフィルター信号過程の状態式である。プロペラの角速度は光スイッチ回路等を利用して計測処理可能なパルス数 y_k に変換する。この場合雑音 w_k は当然これに含まれてくる故、

$$y_k = C_k x_k + w_k$$

で与えられ、これはカルマンフィルターの測定過程の観測式である。カルマンフィルターでは u_k , w_k がガウス性雑音のとき、 x_k の最尤推定値 \hat{x}_k は、

$$\hat{x}_k = \tilde{x}_k + P_k C'_k W_k^{-1} [y_k - (C_k \tilde{x}_k + \bar{w}_k)]$$

で与えられる。ただし、

$$\tilde{x}_k = A_{k-1} \hat{x}_{k-1} + B_{k-1} \bar{u}_{k-1}$$

$$P_k = (M_k^{-1} + C'_k W_k^{-1} C_k)^{-1}$$

$$M_k = A_{k-1} P_{k-1} A'_{k-1} + B_{k-1} U_{k-1} B'_{k-1}$$

であり、 \bar{u}_k , U_k は u_k の、 \bar{w}_k , W_k は w_k の各平均、分散である。このシステムはもちろん可観測であるとする。

金物化されたカルマンフィルターは、重み係数 A_k , B_k ……等をあらかじめ求め、PROM(メモリー)に格納しておいたものと、マイクロプロセッサー等を用いて、観測データー y_k から、 \hat{x}_k を上式通り計算し出力させている。

3-2. A-D 変換の誤差

A-D 変換には、先きに述べたように、その方法上、原理的に伴う量子化誤差、入出力が直線関係にならない非直線誤差、一般アナログ機器でも問題となる利得・オフセット誤差、温度変化、部品劣化等に伴なう確度低下の誤差が存在する。

量子化誤差は、A-D 変換が今 8 ビットのものとすると、これはフルスケールを $1/256$ に等分割するもの故、原理上から $1/512$ の誤差を生じることは避けられない。これを改善するにはレジスターのビット数を多くする以外方法はないが、このようにすると変換速度は低下する。

非直線誤差には、全体的なものと、局所的に折線を示す微分非直線性誤差があり、後者は A-D 変換特有のものである。この誤差のために上記の一分割が飛んでしまうこととなる。

ディジタル機器が温度変化に敏感であるのは、よく計算機室が温度調整されていることからも明らかであり、これは A-D 変換器についても同様である。従って、たとえ 12 ビットの A-D 変換器を用いたとしても、一般に温度係数は良くても $50 \text{ ppm}/\text{C}$ 程度であるから、 20°C の温度変化があると、簡単に 8-9 ビット程度の性能に低下してしまう。最近は、マイクロプロセッサーを組込み、特別な補償回路として機能させ補正を行なっているものもある。

一般に A-D 変換器には、その特性が明示されたものが少なく、また明示されていたとしても、なんら考慮されることなく、いいかげんに使用されているので、その出力されたディジタルデーターにはかなりの誤差があるものと思われる。

3-3. その他のデーター処理

これまで、時系列データーを主とした、ディジタル計測の入出力信号の誤差に伴なうデーター処理につ

いて述べてきた。ここでは最後にこれ以外のものについてふれてみよう。一つは画像データに関するものであり、他の一つは図形データに関するものである。すでにこれらに関しては多くの参考文献があり、また紙数の制限もある故、ここではその概要にふれるにとどめる。

画像入力は一般にテレビ信号で入力され、これは二次元座標各点の濃淡表示でもって、画として認識されている。

従って、画像処理では、アナログ量であるこの濃淡信号をまずA-D変換によりデジタル化し、入力画像をいわゆるデジタル画像に変換する。この変換されたものは、画素ごとの濃度を a_{ij} とすると、 $[a_{ij}]$ とマトリクス表示される故、あとはこれまで同様数学的取扱いによりデータ処理することが出来る。これまでに述べた平均、相関、フィルター法はそのまま（ただし2次元）雑音処理に用いられるが、それだけでなく、その数学上の特色を生かし画像の強調、抽出等にも応用される。これ以外に画像処理の特別なものとしてテクスチャーアクセス、K-L変換等がある。

画像の濃淡をA-D変換する時、ある閾値を定めて、先に述べた a_{ij} を0か1のどちらかの2値にしてしまうと、それは図形と呼ばれるものになる。図形の処理、例えば、移動、回転、縮少、投影等を行なうには、解析幾何学を応用すればよい。図形処理特有のものとして、パターン認識があり、この一つにシングラスパターンが認識法がある。これはパターンを基本パターンと部分パターンの構成関係で記述し、その関係を既知のものと比較判定する方法である。

図形の入力はタブレット等を用いて行なわれ、出力はX-Yプロッターがよく用いられる。図形処理の一例として原地図と並べ、作成したデジタルマップを図-10に示す（神戸大学土地造成研究施設沖村講師の好意による）。これは、さらに種々のデータを加え、防災・資源利用等水工学に限らず土木工学の各部門で活用されることと思われる。

デジタル計測はその機能上、まだまだ発展の余地があり、特に自動化・多変量計測の面で進展することと思われる。これらの方法論を確立するのは、今後の課題であると考える。

参考文献

略

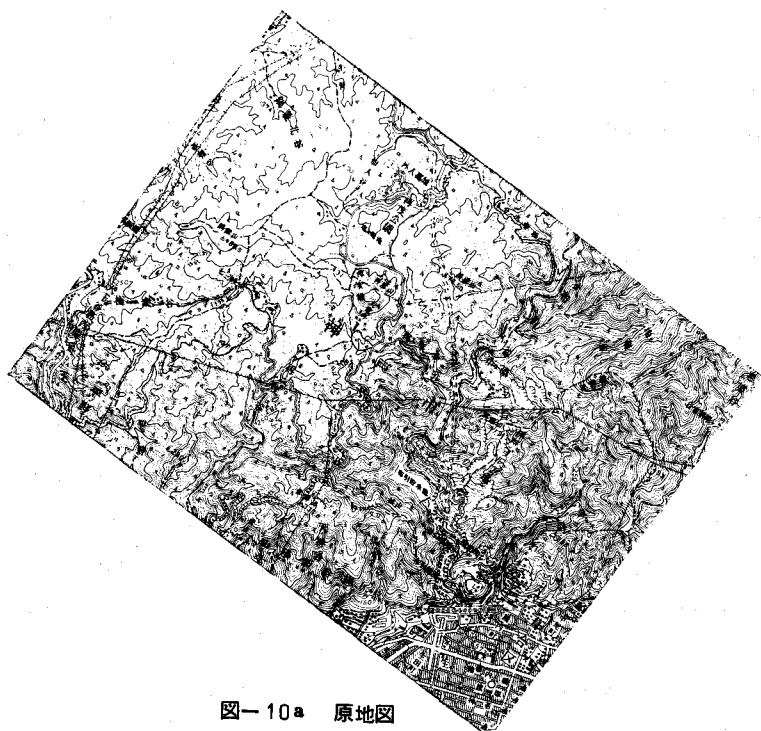


図-10a 原地区

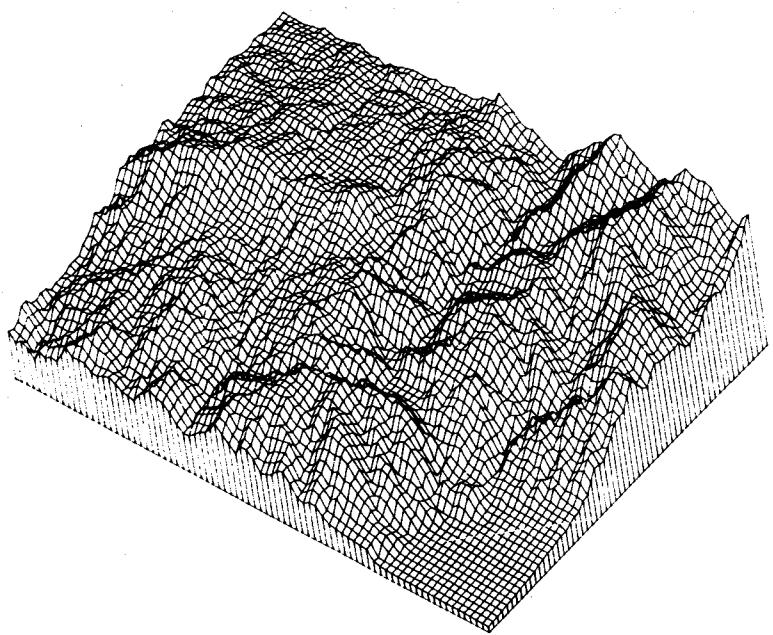


図-10b ディジタルマップ